

INTERNATIONAL  
STANDARD

ISO  
14701

Second edition  
2018-11

---

---

---

**Surface chemical analysis — X-ray  
photoelectron spectroscopy —  
Measurement of silicon oxide  
thickness**

*Analyse chimique des surfaces — Spectroscopie de photoélectrons par  
rayons X — Mesurage de l'épaisseur d'oxyde de silicium*



Reference number  
ISO 14701:2018(E)

© ISO 2018

**Pour plus d'infos, merci de nous contacter.**

**Association Sénégalaise de Normalisation**

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage  
Dakar - SENEGAL

**Tel: +221 33 829 58 25**

**Email: [asn@asn.sn](mailto:asn@asn.sn)**